

株式会社 システムアドバンス 殿

証明書番号 SKQ-3X-1026

発行日 2013年11月6日

校正証明書製品名 : **精密自動二次元座標測定機**形式 : **SMIC-300Ⅲ**

OPTION :

機械番号 : **090103**校正年月日 : **2013年10月31日**校正環境条件 : **ユーザー環境条件下において実施**温度 **22.95 °C**

校正結果は、別紙の通りであることを証明します。

上記製品は、当社の作業標準に基づき校正を行ったことを証明します。
また、この製品の校正に使用した標準器は、公的校正機関(独立行政法人産業技術総合研究所等)にトレーサビリティがとれています。

使用標準器

形式	標準器名	番号	有効期限
12.413	標準尺 400mm	F-29-121	2015年4月
DMT-621/PTR-123	クオーツ温度計	5S2111000	2014年6月

新東Sプレジジョン株式会社



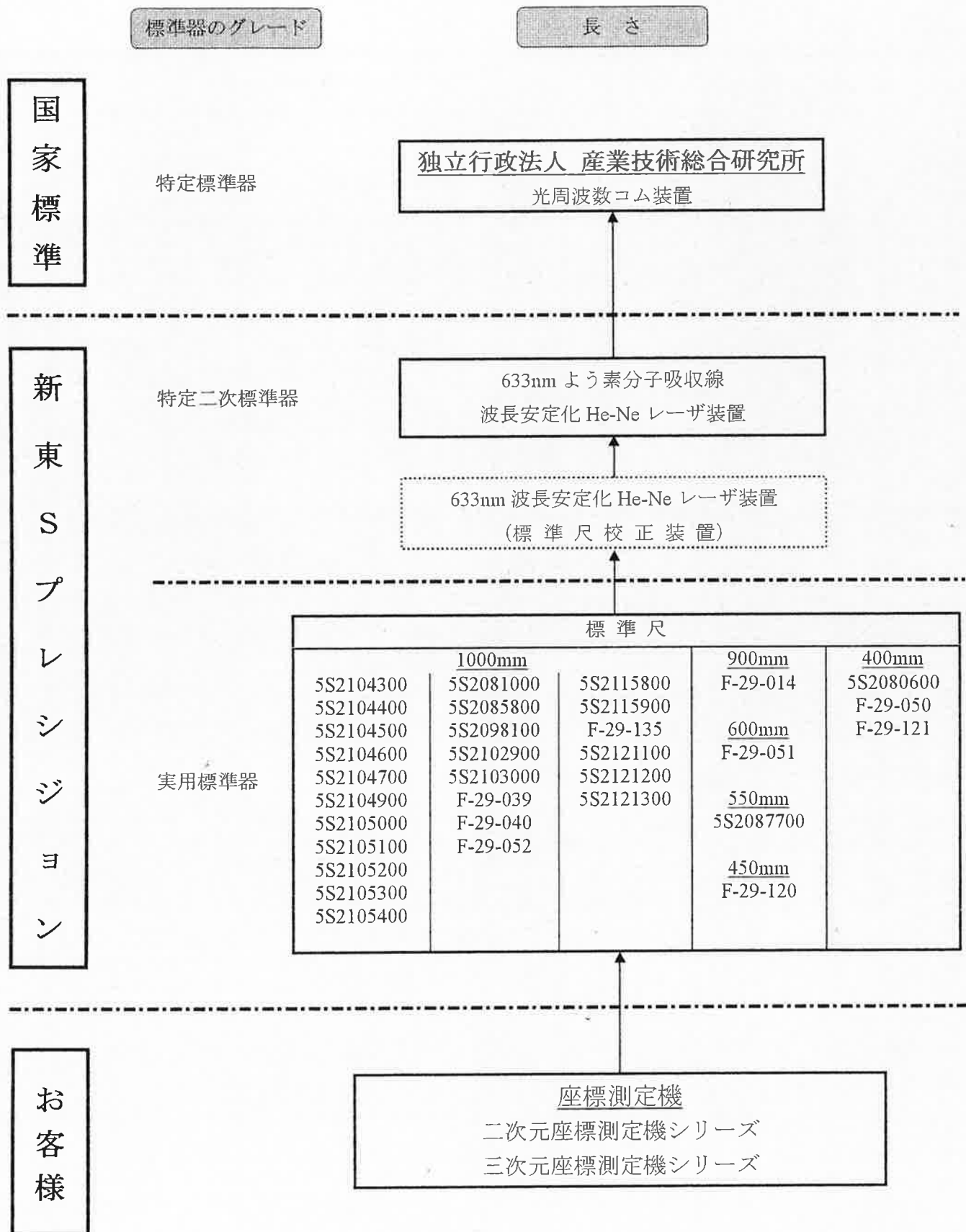
証明書番号 SKQ-3X-1026

校正結果

基準値との差を記載

位置(mm)	基準値(mm)	X軸(μm)	Y軸(μm)
0	0.00000	0.00	0.00
50	50.00114	-0.01	0.02
100	100.00227	-0.01	0.04
150	150.00359	-0.02	0.08
200	200.00489	-0.02	0.08
250	250.00650	-0.04	0.12
300	300.00803	-0.03	0.15
検査担当者 : 赤池 弘章			
承認者 : 渡邊 茂之			
備考 : 使用機器		標準尺	
対物レンズ倍率		x100	

座標測定機 X・Y 軸トレーサビリティ体系図



株式会社 システムアドバンス 殿

証明書番号 SKQ-43-1081

発行日 2014年3月28日

校正証明書製品名 : **精密自動二次元座標測定機**形式 : **SMIC-800ⅢS**

OPTION :

機械番号 : **040404**校正年月日 : **2014年3月27日**校正環境条件 : **ユーザー環境条件下において実施**温度 **23.00** °C

校正結果は、別紙の通りであることを証明します。

上記製品は、当社の作業標準に基づき校正を行ったことを証明します。
また、この製品の校正に使用した標準器は、公的校正機関(独立行政法人産業技術総合研究所等)にトレーサビリティがとれています。

使用標準器

形式	標準器名	番号	有効期限
KGZ-0009	標準尺 1000mm	5S2104500	2014年10月
DMT-621	クオーツ温度計	5S2118100	2014年10月

新東Sプレジジョン株式会社



証明書番号 SKQ-43-1081

校正結果

基準値との差を記載

位置(mm)	基準値(mm)	X軸(μm)	Y軸(μm)
0	0.00000	0	0
100	99.99993	-0.04	0.01
200	199.99998	-0.11	0.01
300	299.99981	-0.11	0.06
400	399.99987	-0.30	0.11
500	499.99996	-0.43	0.18
600	600.00030	-0.47	0.25
700	700.00094	-0.51	0.39
800	800.00159	-0.64	0.46

検査担当者： 赤池 弘章

承認者： 渡邊 茂之

備考： 使用機器 標準尺

対物レンズ倍率 x50

座標測定機 X・Y 軸トレーサビリティ体系図

標準器のグレード 長さ

国家標準

特定標準器

独立行政法人 産業技術総合研究所
光周波数コム装置

新東Sプレジジョン

特定二次標準器

633nm よう素分子吸収線
波長安定化 He-Ne レーザ装置

633nm 波長安定化 He-Ne レーザ装置
(標準尺校正装置)

実用標準器

標準尺				
	1000mm		900mm	400mm
5S2104300	5S2081000	5S2115800	F-29-014	5S2080600
5S2104400	5S2085800	5S2115900		F-29-050
5S2104500	5S2098100	F-29-135	600mm	F-29-121
5S2104600	5S2102900	5S2121100	F-29-051	F-29-207
5S2104700	5S2103000	5S2121200		
5S2104900	F-29-039	5S2121300	550mm	
5S2105000	F-29-040	E5201 30701	5S2087700	
5S2105100	F-29-052	E5201 30702		
5S2105200		E5201 30703	450mm	
5S2105300			F-29-120	
5S2105400				

お客様

座標測定機
二次元座標測定機シリーズ
三次元座標測定機シリーズ

精密自動座標測定機 仕様比較

装置名		-	SMIC300Ⅲ	SMIC800ⅢS	AMIC711HA
設置工場		-			
最大測定物サイズ		W/D/H	400mm×400mm×25mm	1000mm×1000mm×25mm	1000mm×1000mm×78mm (W. D. 約20.5mm)
最大測定物重量		-	10kg	15kg	-
有効測長範囲		X軸/Y軸	300mm/300mm	800mm/800mm	X:700mm Y:800mm Z:78mm
精度*1	短寸法*2	繰返し性	3σ=0.02μm	3σ=0.05μm	-
		再現性	-	3σ=0.20μm	3σ=0.20μm
	長寸法*2	繰返し性	3σ=0.15μm	3σ=0.35μm	3σ=0.60μm
		再現性	3σ=0.40μm	3σ=0.50μm (中央部400mm×400mm内)	3σ=2.0μm (全面内)
		"	-	3σ=0.60μm (800mm×800mm全面内)	
最小測定線幅		-	1μm	-	-
レンズ倍率		高倍	×100倍 (目視 2590倍)	×50倍 (目視 1990倍)	×20倍 (目視 720倍)
		低倍	×50倍 (目視 1290倍)	×25倍 (目視 566倍)	×10倍 (目視 360倍)
駆動速度 (自動移動)		X, Y軸	120mm/sec (max)	160mm/sec (max)	100mm/sec (max)
		Z軸	6mm/sec (max)	6mm/sec (max)	30mm/sec (max)
駆動方式		X, Y軸	リニアサーボモータ駆動	リニアサーボモータ駆動	ACサーボモータによるボールネジ駆動
		Z軸	ボールネジ+ACサーボモータ	ボールネジ+ACサーボモータ	(センタードライブ方式)
駆動分解能		X, Y軸	0.01μm	0.01μm	-
		Z軸	0.02μm	0.02μm	-
最小表示分解能		-	0.001μm	0.001μm	
テーブル平面度		-	10μm以下 (研磨ガラステーブル使用)	-	20μm以下
エアテーブル		-	-	機能;エアによる吸着、及び吹き出しが可能	-
		-	-	対応ワークサイズ;標準仕様 (テーブルウアウト参照)	-
除震機構		-	空気バネ式防振台	空気バネ式防振台	-
本体サイズ		-	1060mm×1095mm×1320mm	1400mm×1950mm×1300mm	1600mm×1600mm×2005mm
測定条件		-	*1・高倍、同軸落射照明での測定時。 ・偏荷重が無い場合。 *2・短寸法測定;軸移動を含まない測定。 (視野内測定) 長寸法測定;軸移動を含む測定。	*1・高倍で測定時。 ・偏荷重が無い場合。 *2・短寸法測定 (視野内測定) :軸移動を含まない測定。 ・長寸法測定:軸移動を含む測定。	*2・高倍で測定時。 ・振動が無い場合。 *3・短寸法測定 (視野内測定) ・長寸法測定:軸移動を含む測定。 ・温度変動 0.3℃/日